●●● 小特集 多価イオン原子過程の基礎と拡がる応用研究

2. 多価イオン原子過程の基礎

2.2 多価イオンー原子・分子・固体表面

本橋健次

東京農工大学 大学院共生科学技術研究院 ナノ未来科学研究拠点

(原稿受付:2007年4月25日)

低速の多価イオンが物質に近づくと、物質から多価イオンへの多数の電子遷移(多電子移行過程)が高い確 率で起こる.物質は、多数の電子をごく短時間のうちに局所的に奪われるため、その後、多くの原子過程を経て 崩壊することになる.本稿では、衝突速度が1原子単位(~2.2×10⁶ m/s)以下の低速多価イオン衝突における多 電子移行過程とその後の標的物質の原子過程について概観する.特に、反応を状態選択的に観測することで、明 らかになってきた物理現象を解説するとともに、最近の動向を紹介する.

Keywords:

state-selective measurement, electron capture, transfer ionization, classical over barrier model, energy gain, potential emission, fragmentation, sputtering

2.2.1 はじめに

多価イオン衝突では、その内部エネルギー(クーロンポ テンシャルエネルギー)の寄与が運動エネルギー(加速エ ネルギー)のそれと同程度か、それ以上になる可能性があ る.このような衝突では、価数の高いイオンがゆっくりと 物質に近づくため、多くの電子が次々と物質から多価イオ ンへ遷移する.一般に、このような多電子移行過程は多価 イオンの電荷 qe (q は多価イオンの価数, e は素電荷)と 衝突速度 v との比(qe)/v が大きいほど起こりやすいと考え られる[1].本稿では、原子単位系で(qe)/v が 1 を超える程 度の低速多価イオン衝突について、多電子移行過程に引続 く物質の崩壊過程について述べる.

多価イオンの最大の特徴は、その大きな内部エネルギー であり、これは物質に対する反応性が高いことを意味す る.電子移行衝突の断面積は入射多価イオンの価数におお よそ比例するので[2]、大雑把に言えば、10価のイオンの反 応断面積は1価のイオンのそれの10倍に及ぶ.しかし、単 に反応性が高いだけの特徴しか持たないとすると、多価イ オンは学問的な魅力に乏しく、応用上も扱いにくい存在で しかない.異論を承知の上で書かせていただくと、著者は、 多価イオンの最大の魅力の一つは、物質との反応における 選択性の高さにあると考えている.

多価イオンと物質との反応に選択性を与えているのは, 第一に,物質内の電子束縛準位と,多価イオンが捕獲しよ うとする準位とのエネルギーの整合性である.第二に,遷 移しようとしている電子が感じる,多価イオンと物質との 間のポテンシャル障壁の高さであり,障壁の高さは両者の 距離で決まることから,これは衝突径数とよく対応する. これらのことから,ちょうどよい価数と衝突径数を選ぶこ とによって,物質内の特定準位の電子を多価イオンに効率 よく遷移させることが可能であると考えられる.

このような視点から,次節以降は様々な標的に対して, 具体的にどんな選択性が見出されてきたかを中心に紹介す る.そして,それらの現象を「古典的オーバーバリアモデ ル」[3,4]という極めて単純な理論がよく説明することを述 べる.このモデルは古典論なので,もちろん定量性には不 十分な点もある.しかし,低速多価イオン衝突の特徴をよ くとらえており,概念的な理解に有効な理論であることか ら,特に実験結果の分析に威力を発揮すると考えられる.

2.2.2 多価イオンー原子衝突

価数 q の多価イオン A^{q+} と原子 B との衝突において r 個の電子移行が起こったとき,その後の崩壊過程として は,例えば以下のような過程がある.

$$A^{q+} + B \rightarrow A^{(q-r)+*} + B^{r+}$$
$$\rightarrow A^{(q-r+s)+} + se^{-} + B^{r+} + \Delta E \qquad (1)$$

これは、多価イオンが最初にr個の電子を捕獲し、その 後、s個の電子を放出(自動電離)した過程である. ΔE は始状態と終状態の内部エネルギー差、すなわち反応熱で ある.多価イオン衝突では、ΔE が大きな正の値をとる発 熱反応が頻繁に起こる.ΔE が100 eV を超えることも珍し くなく、そのため、この余剰エネルギーが多価イオンの加 速エネルギーに転換されることがある.このような、衝突 により与えられた加速エネルギーをエネルギー利得(energy gain)と呼ぶ[5].

2. Fundamental Atomic Processes of Highly Charged Ions 2.2 Highly Charged Ions - Atoms, Molecules and Solid Surfaces MOTOHASHI Kenji author's e

author's e-mail: motohasi@cc.tuat.ac.jp

エネルギー利得を精度よく測定することにより,多価イ オンが最初に電子を捕獲した際の励起状態,すなわち, $A^{(q-r)+*}$ の電子状態を分析することができる.この方法は 並進エネルギー分析法 (TES: Translational Energy Spectroscopy) と呼ばれている.(1)式で表される反応で は,最初r個の電子移行が起こったが,s個の電子の自動電 離を経て,最終的には(r-s)個の電子が捕獲されたことに なる.電子移行に引き続いて自動電離が起こる反応を, Transfer Ionization (TI)と呼ぶ.多価イオン衝突では,こ のTI 過程の断面積が大きいことも特徴の一つである[6].

図1に,並進エネルギー分析結果の典型例を示す[7].こ れは,Ar⁵⁺+Ar(衝突エネルギー250 eV)において,一電 子捕獲確率を散乱角の関数としてプロットした図である. 散乱角0°では4dへの遷移確率が90%を占めることは大変 興味深いが,散乱角が3.6°では,その確率が半減する点も 注目すべきである.一般的には散乱角が大きいほど衝突径 数が小さい.したがって,遠方で電子を捕獲した場合には 4d準位に遷移し,接近してから電子を捕獲した場合には4 p準位に遷移するため,このような遷移確率の変化が起こ ると考えられる.このように,特定の量子状態への電子遷 移が,価数と衝突径数に対して極めて選択的に起こること が実験的に明らかになってきた.

次に、古典的オーバーバリアモデル(COB: Classical Over Barrier model)について簡単に触れる. COB にはいくつか のバージョンがあるが[3,4,8-10], ここでは最も多く使わ れる Niehaus のモデル[3]について、その概要を説明する.

図2に、COBの概念図を示す.多価イオンと標的原子が 接近し、標的原子内の電子のエネルギー準位が、多価イオ ン内のエネルギー準位および、両者の間のポテンシャル障 壁の高さに一致したとき(臨界距離 *R*_C),標的内電子が障 壁を乗り越えて多価イオン側に遷移すると考える.

多価イオンが標的原子に最近接するまでの入射経路(図2(a)~(c))では、これらの過程が繰返される.核間距離が再び増加に転じた後の出射経路(図2(d))では、ポテンシャル障壁が上昇するので、電子が多価イオン側に取り残



図1 Ar⁵⁺+Ar 衝突における一電子捕獲確率の散乱角依存性 [7].4dと4pはAr⁴⁺の電子捕獲準位,TIはTransfer Ionization 過程(本文参照).



 図2 古典的オーバーバリアモデル[3] における電子移行過程の
 概念図.(a)と(b)は入射経路,(c)は最近接状態,(d)は
 出射経路.bは衝突径数, Rcは電子移行に対する臨界距離, *O* は散乱角.

される. その理由は, 多価イオンの準位が高励起状態に相 当するので, その統計重率 2n²(n は主量子数) が標的原子 に比べ概して大きいためである. 一度分子状態を形成した 電子が, 多価イオンに捕獲されるか標的原子に戻るかは, 個々の電子によって異なるので, 多価イオンに捕獲される 場合は1を, 標的原子に戻る場合は0を付した文字列 (String) により電子移行過程を区別する. 例えば, 図2 (d)の(1,0)という String は, 標的の最外殻電子1個が多 価イオンに捕獲され, 内殻の電子が標的に戻った一電子捕 獲過程を表す.

移行電子が感じるポテンシャルエネルギーは,内側に存 在する電子による核電荷の遮蔽を考慮した水素様近似で計 算される.このポテンシャル曲線を用いて,電子移行が起 こる核間距離が導かれる.電子捕獲断面積は統計重率の比 と核間距離から計算される.始状態と終状態のエネルギー 差(ΔE)は,Stringごとに求めることができる.

図3は、Ar⁵⁺+Ar (衝突エネルギー:9keV) でAr^{k+} (k は散乱イオンの終状態の価数)が生成される電子捕獲断 面積を示している[3].全体的に COB の計算値は実験値に 対してやや大きめであるが、これだけ単純なモデルにもか かわらず、断面積の理論値と実験値が 30%程度の範囲で 一致するのは、むしろ驚きである.

2.2.3 分子標的

標的が分子の場合,電子捕獲によって生成された分子イ オンからの解離が起こる.分子 BC の解離を含む反応とし ては,例えば以下のようなものがある.

$$A^{q_{+}} + BC \rightarrow A^{(q,r)+*} + BC^{r+} \perp \Delta E$$

$$\rightarrow A^{(q,r+s)+} + se^{-} + BC^{r+}$$

$$\rightarrow A^{(q,r+s)+} + se^{-} + B^{t+} + C^{(r-t)+}$$
(2)



図3 Ar⁵⁺+Ar→Ar^{*i*+}+Ar^{*k*+}における電子捕獲断面積[3](実験値の衝突エネルギーは9 keV). ○と実線,一電子捕獲過程のCOB計算値(*k*=5-*j*). ●,実験値(*k*=5-*j*). △と破線,二電子捕獲(TI)過程のCOB計算値(*k*=5-*j*+1). ▲,実験値(*k*=5-*j*+1).

前節で述べたように、低速多価イオン衝突では、標的の 外殻電子から順番に電子が奪われる断面積が大きい. その ため、分子結合に関与する価電子が捕獲される確率が高 く、一電子移行しか起こらなくても解離が起こりやすい. もっとも、分子イオンの電子状態が解離過程を大きく左右 するので、一概には言えないことも明記しておく. 特に、 分子の内殻電離状態が形成されれば、自動電離と解離が競 合することは、よく知られている[11].

ところで前節では、原子標的に対する多価イオンの選択 的な電子捕獲過程について述べた.分子に対してもそのよ うなことが起こるならば、価数と衝突径数を選ぶことに よって、分子BCから特定の電子が捕獲されるため、特定の 解離過程が選択的に誘起される可能性がある.著者らはこ の点に注目し、多価イオンの電子移行に起因する解離過程 の画像観測実験を行った[12,13].

散乱角0°の散乱イオンを観測することにより近接衝突 の過程を除き,分子の外殻価電子空孔状態からの解離過程 を観測しようと考えた.散乱角0°を選んだ理由はもう一 つある.それは,衝突エネルギーが反応熱に比べて十分大 きければ,電子捕獲で生成された分子イオンの反跳エネル ギーが無視できるからである[5,7].この場合,反応熱 *ΔE*とエネルギー利得*Q*が近似的に等しくなり[7],かつ, BC^{r+}の分子重心はほとんど動かないので,B^{t+}とC^{(r-t)+}の 運動量をそれぞれ独立に測定することができる.

図4は、Ar^{q+}(q=3-12)をCF₄分子に8keVで衝突させ たときの、Ar^{(q-1)+}のエネルギー利得スペクトルである. 入射価数が増加すると、エネルギー利得のピーク位置が高 エネルギー側にシフトし、多電子移行による TI 過程(図中 では D, T, Qというラベルのピーク)の寄与が増加するこ とが分かる.図5は、これらのエネルギー利得スペクトル のピークエネルギーを、入射イオンの価数 q に対してプ ロットした図で、曲線はそれぞれの電子移行過程に対する COBの理論値である.理論値と実験値はまずまずの一致を 示している.

次に, TES 分析器を個々のエネルギー利得スペクトルの ピーク位置に合わせておき, そのエネルギー利得を持つ散 乱イオンが検出器に到達したときだけ, 解離イオンを検出



図4 Ar^{q+}(q=3-12)+CF4衝突におけるAr^{(q-1)+}のエネルギー 利得スペクトル(●印)[12]. ○,入射イオン(利得0)のス ペクトル.S,一電子移行(r=1,s=0).D,二電子移行 (r=2,s=1).T,三電子移行(r=3,s=2).Q,四電子移 行(r=4,s=3).



 図5 Ar^{q+}(q=3-12)+CF4衝突におけるAr^{(q-1)+}のエネルギー利 得 Q の q 依存性[12].●,一電子移行の実験値.▲,二電 子移行の実験値.■,三電子移行の実験値.▼,四電子移行 の実験値.実線,一電子移行(r=1,s=0)の COB計算値. 破線,二電子移行(r=2,s=1)の COB計算値.点線,三 電子移行(r=3,s=2)の COB計算值.

するというコインシデンス測定を行なった[12,13]. 図 6 は、異なるエネルギー利得における、解離イオンの飛行時 間質量分析 (Time-of-Flight Mass Spectroscopy: TOF-MS) 結果である[12]. 図の(a)と(b)は、Ar⁸⁺衝突において Ar⁷⁺を検出している点では同じであるが,Ar⁷⁺のエネル ギー利得が異なるためにTOFスペクトルがまったく異な る.特に,CF $_3^+$ の強度とCF $_2^+$ の強度は逆転している.(a) の過程は、図4のSのスペクトルに対応し、単純な一電子 移行によるCF $_4^+$ からの解離に相当する.これに対し,(b) の過程は図4のDに対応し,TI過程(二電子移行+自動電 離)により生成されたCF $_2^+$ からの解離に相当する.すなわ ち,散乱イオンのエネルギー利得を選別することにより電 子移行過程が選別され、その結果、解離過程も選別された わけである.

さらに、解離過程の選択性は、解離イオンの三次元運動 量分布と運動エネルギー分布にも明瞭に現れた.図7の上 段(a)-(c)と下段(d)-(f)は、図6の(a)および(b)と同様、 エネルギー利得が15 eV と33 eV のときにそれぞれコイン シデンス測定されたF⁺イオンの運動量画像と余剰運動エ ネルギー(KER: Kinetic Energy Released)分布である[12]. 余剰運動エネルギーとは、励起状態にある分子が解離する 際に、その内部エネルギーが個々の解離片(原子・分子)に



図 6 Ar⁸⁺ + CF₄ 衝突において Ar⁷⁺ (エネルギー利得 Q)と同時 計測された解離イオンの飛行時間質量スペクトル[12]. (a) Q = 15.4 eV; (b) Q = 33.1 eV.

運動エネルギーとして分配されたものである.

ー電子移行で生成された CF_4^+ から解離した F^+ の運動量 (a) と (b) は小さく中心に集まっており,運動エネルギー (c) も 1 eV 以内にほぼ収まっている.一方,二電子移行で 生成された CF_4^{2+} から解離した F^+ の運動量 (d) と (e) は大き く球殻状に広がり,運動エネルギー分布 (f) は 2 eV 付近に 最大値を持ち 10 eV 近くまで広がっている.

既に述べたように、エネルギー利得*Q* が反応熱 ΔE と近 似的に等しくなる条件で実験を行ったので、もし解離イオ ンのKER分布から分子イオンBC^{*+}の状態を特定すること ができれば、(2)式のエネルギー収支からA^{(q-r)+*}の状態 を特定することができる.図8は、一電子移行で生成され たCF₃*の三次元運動量画像と運動エネルギー分布である (図6(a)参照).図8(c)の中の矢印は、電子衝突[14,15] で測定された運動エネルギーピーク位置を表しており、本 測定結果のピーク位置とよく一致している.そして、この ような運動エネルギーを与えるCF₄^{**}の励起状態が \tilde{C}^2T_2 であることは、電子衝突・イオン衝突・光吸収の実験から もよく知られている[14,16,17].

(2)の最初の式における ΔE と BC^{r+}の状態が実験的に 決まったので、A^{(q-r)+*}を特定することが可能になり、結 局解離も含めた全ての状態を実験的に特定することができ た.

$$\begin{array}{r} \operatorname{Ar}^{8^{+}}(2\mathrm{p}^{6}\,{}^{1}\mathrm{S}_{0}) + \operatorname{CF}_{4}(\tilde{X}^{1}A_{1}) \\ \rightarrow \operatorname{Ar}^{7^{+}*}(2\mathrm{p}^{6}\mathrm{5d}\,{}^{2}\mathrm{D}_{J}) + \operatorname{CF}_{4}^{+}*(\tilde{C}^{2}T_{2}) + 15.4 \,\mathrm{eV} \\ \rightarrow \operatorname{Ar}^{7^{+}*}(2\mathrm{p}^{6}\mathrm{5d}\,{}^{2}\mathrm{D}_{J}) + \operatorname{CF}_{4}^{+}*(\tilde{A}^{2}T_{2}) + h\nu \\ \downarrow \\ F + \operatorname{CF}_{3}^{+} + 1.2 \,\mathrm{eV} \end{array}$$
(3)

すなわち,最初に一電子移行により $Ar^{7+*}(2p^{6}5d\ ^{2}D_{J})$ と CF₄^{+*}($\tilde{C}^{2}T_{2}$)が生成され,次にCF₄^{+*}($\tilde{C}^{2}T_{2}$)がUV光子放出 (200-500 nm)[18] により $\tilde{A}^{2}T_{2}$ へ遷移し,最後にその余 剰エネルギー 1.2 eV が F と CF₃⁺の質量比で分配された結 果,0.3 eV の運動エネルギーを持つ CF₃⁺が生成された.ち なみに,COB の計算では Ar^{7+*} のエネルギー利得Q = 17.0



 図7 Ar⁸⁺ + CF4 衝突における一電子移行(r=1, s=0)反応と二電子移行(r=2, s=1)反応で生成された F⁺の三次元運動量画像と運動エネ ルギー(KER)分布[12].(a),(b),(c)一電子移行(Q=15.4 eV).(d),(e),(f)二電子移行(Q=33.1eV).多価イオンの入射方向が x 軸正の方向,飛行時間型質量分析器(TOF 分析器)における解離イオンの加速方向が z 軸正の方向.



図8 Ar⁸⁺ + CF4 衝突における一電子移行 (r = 1, s = 0) 反応で生成された CF¹→の三次元運動量画像と余剰運動エネルギー(KER) 分布[12]. (c)の中の矢印は、電子衝突の KER ピーク位置[14,15].多価イオンの入射方向が x 軸正の方向,飛行時間型質量分析器(TOF 分析器)における解離イオンの加速方向が z 軸正の方向.

eV と,有効主量子数 $n^* = 5.1$ が得られた[12].この値は実験値 (Q = 15.4 eV, n = 5)とよく一致しており,理論的にも整合性が確認された.この他, $Ar^{3+} + N_2$ 衝突の一電子移行衝突では, N_2^{**} から解離した N^+ の運動エネルギー分布に, N_2^{**} ($C^2\Sigma_u^+$)の振動状態を反映する微細構造と,前期解離が確認された[13].

以上に述べたように、散乱角0°という特殊な状況下で はあるが、電子移行過程だけでなく解離プロセスまでが価 数と衝突径数によって選別されることがわかってきた.多 価イオン-分子衝突の実験的研究は、画像粒子観測技術の 進歩に伴い、近年急速に進展しており、興味深い現象がい くつか見出されている.例えば、(qe)/v が100を超えるほど 大きい値になると、散乱イオンが分子の解離過程に影響を 及ぼすことがわかってきた[19,20].時間分解二次元粒子 検出器を駆使した多次元粒子検出により、衝突動力学に対 する完全実験を目指す試みも始まっている.

2.2.4 固体表面標的

標的が固体表面になると、原子過程は急に複雑になる. その原因は数多くあるが、代表的には、1.多体衝突である こと、2.真空中の反応と固体内の反応を分離することが 難しいこと、3.表面の状態(吸着、欠陥、平坦性等)が反 応に大きな影響を及ぼすこと、などが挙げられる.このた め、原子や分子との衝突に比べて、個別の反応を取り出す ことが難しく、著者の知る限り、電子移行過程とその後の 固体原子構造変化を量子状態選別して観測した例はない. その意味では、多価イオンによる固体表面反応の研究は、 まだ初期段階にあると考えられ、ブレークスルーが待ち望 まれる領域の一つといえる. 一方,多価イオンが固体表面に接近する場合も,原子・ 分子とよく似た電子移行過程が起こっていることがわかっ てきた.すなわち,固体表面上空でも,表面と多価イオン の間に形成されるポテンシャル障壁を乗り越えて電子遷移 が起こること,移行電子の量子準位を COB モデル[4]でよ く説明できることが確かめられた[21].このことは,少な くとも多価イオンが真空側に存在するまでの間は,電子移 行過程を価数と衝突径数(もしくは入射角)により選別で きることを示唆している.しかしながら,一度,多価イオ ンが固体内に進入すれば,多数回の衝突や固体内の緩和過 程が避けられないため,表面反応を状態選択的に選別し, 制御することは極めて困難になる.

これを回避する一つの方法は,直径 100 nm 程度の貫通 した多数の細管を有する,厚さ数µm 程度の薄膜(キャピラ リー薄膜標的)を用意し,多価イオンがこの細管の内壁で 電子を捕獲する過程を観測するというものである[21,22]. このような標的の場合,内壁に対して適当な衝突径数で入 射した多価イオンは,表面から電子を捕獲した後,薄膜を 透過することが可能になる.

多価イオンの電子捕獲による固体表面からの粒子放出 は、ポテンシャル放出と呼ばれ、通常の運動量放出と区別 される.近年、固体表面に吸着した炭化水素分子や水分子 からのH⁺放出が、多価イオン衝突で顕著に起こることが 見出され、その収量が入射多価イオンの価数の3乗から5 乗に比例するという結果が報告された[23-26].そして、 COB理論に基づくモデル計算により、これらの実験結果が 定量的に説明されたことから[24]、このH⁺放出がポテン シャル放出であることはほぼ間違いないとされている.一 方、固体を構成する原子のポテンシャル放出に関しては、 多価イオンの価数や標的固体の種類によって様々なモデル が存在し[27-30]、統一的な見解は得られていないのが現 状である.

最後に、多価イオン – 固体表面衝突における状態選択的 研究に関して、一つの指針を与える結果について簡単に触 れる.ウィーン工科大のグループは、フッ化リチウム表面 で中性化した散乱多価イオンのエネルギー損失(入射イオ ンと散乱原子の運動エネルギー差)と、二次電子の放出個 数を同時計測することにより、エネルギー損失がゼロの中 性化過程に対する二次電子収量 $\gamma_{AE=0}$ を測定した.その結 果、 $\gamma_{AE=0}$ が入射多価イオンのポテンシャルエネルギー E_{pot} と以下の関係にあることを見出した[31].

 $\gamma_{\Delta E=0} = E_{\text{pot}}/(2W) \tag{4}$

ここで、W は固体の仕事関数である.この式は、1個の二 次電子放出には仕事関数の2倍のポテンシャルエネルギー が必要であることを意味しており、言い換えれば、二次電 子のポテンシャル放出がオージェ過程により起こることを 示している.これは、運動量放出とポテンシャル放出を分 離することに成功した世界初の成果であり、量子状態選別 へ向けての最初の布石として大きな意義を持つと考えられ る.

2.2.5 まとめと今後の課題

多価イオンと物質との低速衝突における電子移行過程と その後の原子過程が、多価イオンの価数や衝突径数とどの ように対応するかを、状態選別の立場から概観した.そし て、古典的オーバーバリアモデルについて紹介するととも に、これが実験結果の定性的な分析に威力を発揮すること を、実例とともに紹介した.特に分子標的では、電子移行 過程を選別することにより、その後の解離過程も選別可能 であることがわかってきた.固体表面では、同時計測によ り表面上空(真空側)での電子移行過程を選別することが、 有力な一つの方法であると考えられる.

今後,反応の観測から制御へと発展させていくために は,原子核の動力学制御や摂動場の併用など,新しい実験 技術の導入も視野に入れる必要があると考えられる.

参考文献

- R.E. Olson and C.R. Feeler, J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 34, 1163 (2001).
- [2] M. Kimura, N. Nakamura, H. Watanabe, I. Yamada, A. Danjo, K. Hosaka, A. Matsumoto, S. Ohtani, H.A. Sakaue, M. Sakurai, H. Tawara and M. Yoshino, J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 28, L643 (1995).
- [3] A. Niehaus, J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 19, 2925 (1986).
- [4] J. Burgdörfer, P. Lerner and F.W. Meyer, Phys. Rev. A 44, 5674 (1991).
- [5] J.P. Giese, C.L. Cocke, W. Waggoner, L.N. Tunnell and S. L. Varghese, Phys. Rev. A 34, 3770 (1986).
- [6] R.W. Schmieder and R.J. Bastasz, AIP Conf. Proc. **274**, 675 (1993).
- [7] S. Yaltkaya, E.Y. Kamber and S.M. Ferguson, Phys. Rev. A 48, 382 (1993).
- [8] H. Ryufuku, K. Sasaki and T. Watanabe, Phys. Rev. A 21, 745 (1980).
- [9] A. Bárány, G. Astner, H. Cederquist, H. Danared, S. Huldt, P. Hvelplund, A. Johnson, H. Knudsen, L. Liljeby and K.-G. Rensfelt, Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B 9, 397 (1985).
- [10] A. Ichimura and T. Ohyama-Yamaguchi, Phys. Scr. T80 B, 190 (1999).
- [11] N. Saito, A. De Fanis, I. Koyano and K. Ueda, Phys. Scr. T110, 90 (2004).
- [12] K. Motohashi and S. Tsurubuchi, J. Phys. B: At. Mol. Opt.

Phys. 36, 1811 (2003).

- [13] S. Tsurubuchi and K. Motohashi, J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 36, 3847 (2003).
- [14] K. Furuya, E. Koto and T. Ogawa, J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 34, 1405 (2001).
- [15] U. Müller, M. Lange, W. Haas and R. Brenn, J. Chem. Phys. 100, 5550 (1994).
- [16] J.C. Creasey, I.R. Lambert, R.P. Tuckett, K. Codling, L.J. Frasinski, P.A. Hatherly, M. Stankiewicz and D.M.P. Holland, J. Chem. Phys. 93, 3295 (1990).
- [17] K. Motohashi, T. Takahashi, N. Takahashi and S. Tsurubuchi, J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 38, 3339 (2005).
- [18] J. Sasaki, I. Kuen and F. Howorka, J. Chem. Phys. 86, 1938 (1987).
- [19] R.D. DuBois, I. Ali, C.L. Cocke, C.R. Feeler and R.E. Olson, Phys. Rev. A 62, 060701(R) (2000).
- [20] T. Kaneyasu, T. Azuma and K. Okuno, J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 38, 1341 (2005).
- [21] Y. Morishita, R. Hutton, H.A. Torii, K. Komaki, T. Brage, K. Ando, K. Ishii, Y. Kanai, H. Masuda, M. Sekiguchi, G. B. Rosmej and Y. Yamazaki, Phys. Rev. A 70, 012902 (2004).
- [22] Y. Yamazaki, S. Ninomiya, F. Koike, H. Masuda, T. Azuma, K. Komaki, K. Kuroki and M. Sekiguchi, J. Phys. Soc. Jpn. 65, 1199 (1996).
- [23] K. Motohashi, S. Tsurubuchi and A. Koukitu, Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B 232, 254 (2005).
- [24] J. Burgdörfer and Y. Yamazaki, Phys. Rev. A 54, 4140 (1996).
- [25] K. Kuroki, K. Komaki and Y. Yamazaki, Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B 203, 183 (2003).
- [26] N. Okabayashi, K. Komaki and Y. Yamazaki, Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B 232, 244 (2005).
- [27] H.-P. Chen and J.D. Gillaspy, Phys. Rev. B 55, 2628 (1997).
- [28] T. Schenkel, A.V. Hamza, A.V. Barnes, D.H. Schneider, J.C. Banks and B.L. Doyle, Phys. Rev. Lett. 81, 2590 (2998).
- [29] F. Aumayr, P. Varga and HP. Winter, Int. J. Mass Spectrom. 192, 415 (1999).
- [30] G. Hayderer, S. Cernusca, M. Schmid, P. Varga, HP. Winter, F. Aumayr, D. Niemann, V. Hoffmann, N. Stolterfoht, C. Lemell, L. Wirtz and J. Burgdörfer, Phys. Rev. Lett. 86, 3530 (2001).
- [31] J. Stöckl, T. Suta, F. Ditroi, HP. Winter and F. Aumayr, Phys. Rev. Lett. **93**, 263201 (2004).